

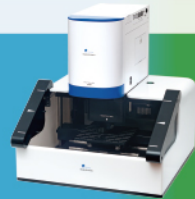
膜厚計ラインナップ

研究開発

品質管理

各種生産ライン

微小エリア計測



OPTM シリーズ
(顕微分光膜厚計)

マクロエリア計測



FE-300F
(分光膜厚計)

ラインスキャンタイプ



LS シリーズ
(ラインスキャン膜厚計®)

フィルム生産ライン組込



LS シリーズ
(ラインスキャン膜厚計®)

マルチパーパス

ファイバータイプ



MCPD シリーズ
(マルチチャンネル分光器)

フィルム生産ライン組込



エリプソパラメータ

FE-5000S
(分光エリプソメータ)



ハンディタイプ

SM シリーズ
(スマート膜厚計)



半導体設備組込

SF-3/
OPTM ヘッド /
MCPD
(組込型膜厚計)



半導体設備組込

GS-300
(成膜・加工装置ローダ対応)